

Electrical and Photovoltaic Properties of Copper Gallium Sulfide (CuGaS₂) Thin Films

F. S. BAHABRI

Faculty of Girls College, Jeddah, Saudi Arabia.

ABSTRACT. Electrical resistivity ρ in the dark, had measured as a function of temperature, and the result showed a semiconductor behavior with activation energy at $\Delta E_1 = 0.674$ eV, which suggests an intrinsic transition of the semiconductor, while the other activation energy $\Delta E_2 = 1.78$ eV, suggests an extrinsic transition semiconductor, Cross the band gap $E_g^{elect} = 2\Delta E$ equal to 2.454 eV.

This value was in good agreement with many other researches where the optical energy gap is $E_g^{opt} = 2.42$ eV, which we measured in this work.

Through out the investigation of the current-voltage (I-V) characteristic of the (Au/CuGaS₂/Si/Al) hetero junction. The series resistance, shunt resistance and the most parameters at this study (p-n junction parameters) were listed in tables (1-1) & (1-2) & (1-3) respectively. Also the study covered the capacity-voltage (C-V) characteristics for the p-n junction. This solar cell shows some important results from current-voltage curves under illumination, which shows some importance in conversion of efficiency and sought for similar junctions, these parameters were :

$\eta = 1.4 \%$	$\eta = 1.15 \%$
FF = 0.47	FF = 0.48
$I_{sc} = 95 \mu$ Amp	$I_{sc} = 77 \mu$ Amp
$V_{oc} = 0.4$ volt	$V_{oc} = 0.35$ volt

The analysis of C-V characteristics of p- CuGaS₂ / n- Si :-

Hetero junction makes it possible to determine :

- 1) The capacity of the junction with the voltage.
- 2) The width of the depletion region.
- 3) The built in voltage.

- [8] Miyazaki, T., Shirakata, S. and Isomura, S. *Jpn. J. Appl. Phys.*, **30**, L1850 (1991).
- [9] Oueriagli, A., Kassi, H., Hotchandani, S. and Leblanc, R.M. *J. Appl. Phys.*, **1**, 5523 (1992).
- [10] Shay, J.L., Bridenbough, P.M., Tell B. and Kasper, H.M. *J. Luminescence*, **6**, 140 (1973).
- [11] Shay, J.L. and Wernick, J.H. *Ternary Chalcopyrite Semiconductors; Growth, Electronic Properties and Applications* (Pergamon Press, Oxford) P. 118 (1975).
- [12] Shirakata, S., Saiki, K. and Isomura, H. *J. Appl. Phys.*, **68**, 291 (1990).
- [13] Song, H.J., Park, K.D., Park, T.Y. and Park *J. Korean. Phys. Soc.*, **79**, 82 p. 4 (2000).
- [14] Tanakaa, K., Uchikia, H., Iidaa, S., Terasakob, T. and Shirakatob, S. *Solid State Communications*, **114**, 197-201 (2000).
- [15] Tell, B., Shay, J.L. and Kasber, H.M. *Phys. Rev.*, **B4**, 2463 (1971).
- [16] Teranishi, T., Saton, K. and Kondo, K. *J. Phys. Soc. Japan.*, **36**, 1618 (1974).
- [17] Yamamoto, N. and Miyauchi, T. *Japan. Appl. Phys.*, **11**, 1383 (1972).
- [18] Yamamoto, N., Tohge, N. and Miyauchi, T. *J. Appl. Phys.*, **Vol.14**, No.2, 192 (1975).

(ب) دراسة الوصلة الثنائية المكونة من السيليكون من النوع n عليه مادة من المركب CuGaS_2 من النوع p ودراسة خصائصها كخلية شمسية :

تمت دراسة منحنيات (التيار-جهد) و (السعة-جهد) للوصلات الثنائية غير المتجانسة من شرائح من المركب p-CuGaS₂ على سيليكون من النوع n ، وذلك لاستنتاج بارامترات الوصلة والتي تحدد أدائها وكانت على النحو التالي:

$R_c=1250 \Omega$	مقاومة التسلسل
$R_{sh}=3.7 \times 10^5 \Omega$	مقاومة التجزئة
$RR=1 \times 10^2 \Omega$	عامل التقويم
$\Phi_n=0.1 \text{ volt}$	ارتفاع حاجز الجهد

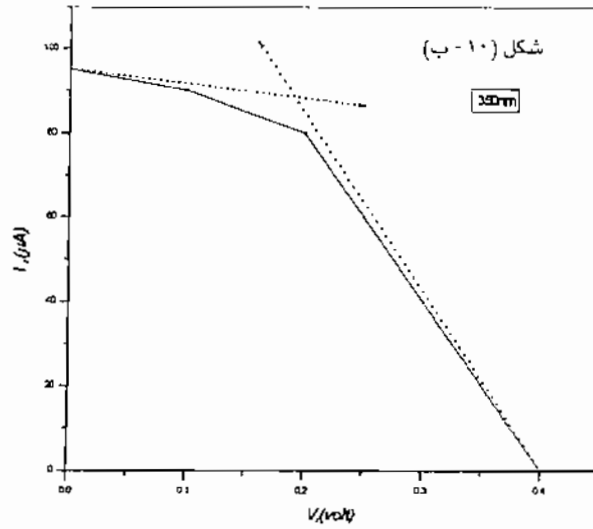
تم دراسة الخلية الشمسية لهذه الوصلات غير المتجانسة وكانت بالقيم الآتية:

$V_{oc}=0.35 \text{ vol}$	جهد الدائرة المفتوحة
$I_{sc}=77 \mu\text{A}$	تيار دائرة القصر
$I_m=65 \mu\text{A}$	أقصى قيمة للتيار " القيمة العظمى "
$V_m=0.2 \text{ volt}$	أقصى قيمة للجهد " القيمة العظمى "
$FF=0.482$	عامل الامتلاء

وبالتالي تم استنتاج كفاءة الخلية وكانت تساوي % 1.15 ، وهذه النتيجة تم التوصل إليها ولم نستطع تأكيد قيمتها إن كانت مناسبة أم لا لعدم وجود أبحاث في هذا الخصوص.

المراجع References

- [1] Antohe, S., Tomozeiu, N. and Gognea, S. *Phys. Stat. Sol. (a)* **125**, 397 (1991).
- [2] Botha, J.R., Branch, M.S., Chowles, A.G., Leitch, A.W. and Weber, J. *Physica*, **B 308-310**, 1065-1068 (2001).
- [3] Emziane, M., Bernede, J.C., Ouerfelli, J., Essaidi, H. and Barreau, A. *J. Phys. Chem.liq.* Vol. 3 , 5 (1999).
- [4] Horinaka, H., a a o o, . and Miyauchi, T. *Jpn. J. Appl. Phys.*, **1** , 521 (1978).
- [5] Kutzer, V., Lummer, B., Heitz, R., Hoffmann, A., Broser, I., Kurtz, E., and Hommel, D. *J. Cryst. Growth*, **159**, 776 (1996).
- [6] Loutfy, R.O., Sharp, J.H., Hsiao, C.K. and Ho, R. *J. Appl. Phys.*, **52**, 898 (1981).
- [7] Masse, G. *J. Appl. Phys.*, **58**, 930 (1985).



شكل (١٠-ب) : العلاقة بين التيار - جهد للوصلة الثنائية في حالة الإضاءة للسمك ٣٥٠ نانومتر .

الاستنتاجات

(أ) الخصائص الكهربائية الانتقالية :

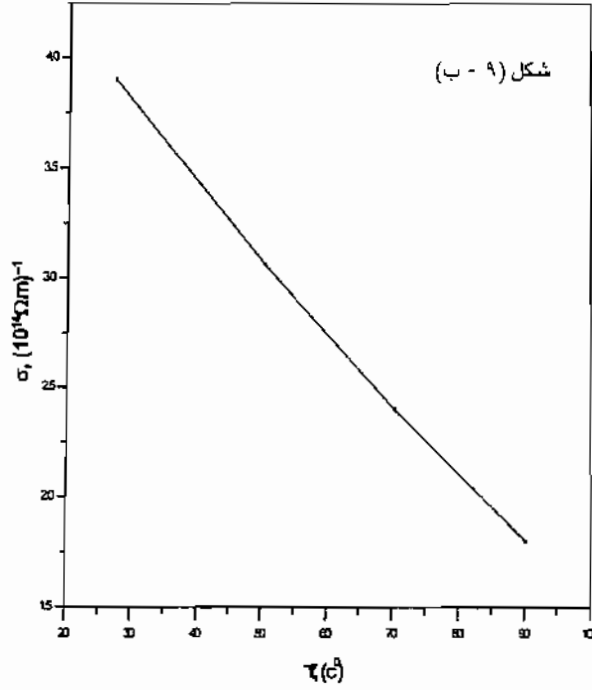
١- أوضحت قياسات المقاومة النوعية الكهربائية ρ في حالة الإظلام اعتمادها على سمك الشرائح الرقيقة حيث تتناقص المقاومة النوعية الكهربائية ρ مع زيادة السمك ، لسمك 122 و 350 نانومتر، وهذا يعود إلى تزايد الحجم الحبيبي للتبلورات وهذا ما أكدته دراسة التركيب البلوري.

٢- دراسة المقاومة النوعية الكهربائية ρ كدالة مع مقلوب درجة حرارة العينات، أعطت خطين مستقيمين مختلفين في الميل ، وهذا هو السلوك الطبيعي لأشباه الموصلات ، ومن ميل هذه الخطوط المستقيمة ، أمكن استنتاج طاقتي التنشيط الحراري ΔE_1 و ΔE_2 و عند درجات الحرارة العالية نسبياً وجد أن قيمة:

$$\Delta E_1 = 0.674 \text{ eV}$$

$$\Delta E_2 = 1.78 \text{ eV}$$

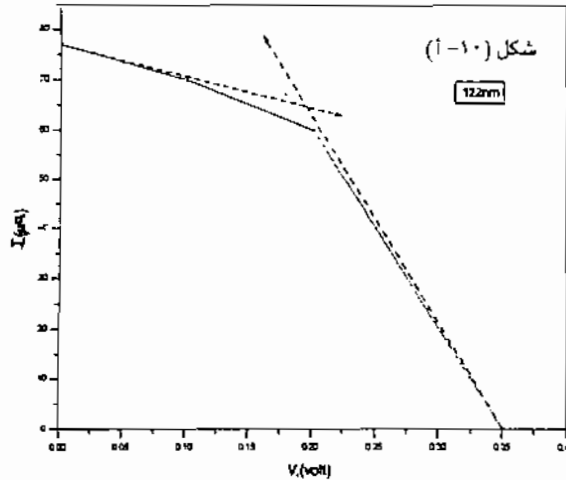
والتوصيل في هذا المدى لدرجات الحرارة يؤكد أن هناك توصيلاً ذاتياً و آخر غير ذاتي و بفجوة طاقة كهربائية $\Delta E = 2 E_g$ ، و هذه القيمة المستنتجة لفجوة الطاقة الكهربائية تساوي 2.454 إلكترون فولت تتفق مع القيم المستنتجة في الأبحاث السابقة [2, 3, 13, 14].



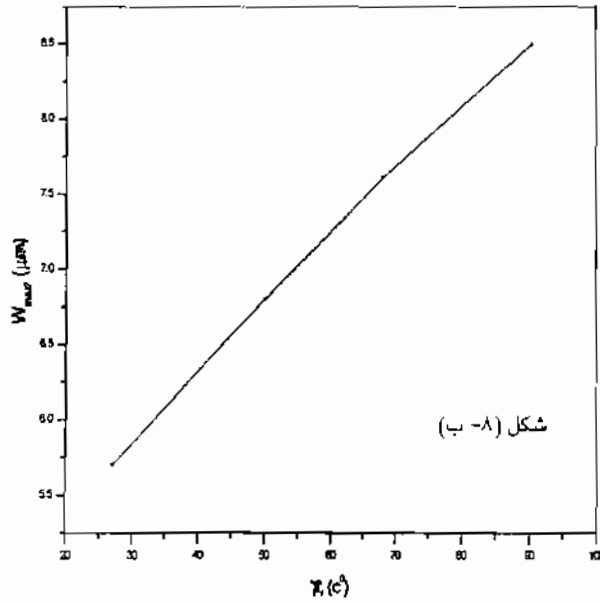
شكل (٩-ب): العلاقة بين الموصلية σ مع درجة الحرارة T للسمك ٣٥٠ نانومتر.

٧. الوصلة الثنائية p-CuGaS₂/n-Si كخلية شمسية p-CuGaS₂/n-Si as a solar cell

تم قياس منحنيات (التيار - جهد) تحت تأثير الضوء لاستنتاج بارامترات الخلية الشمسية وكنموذج لما تم استخراجها من نتائج فإن الوصلة الثنائية من النظام p-CuGaS₂/n-Si ولسمك يساوي (350, 122) نانومتر ، عينت لها بارامترات الوصلة الثنائية كما هو مدون بالجدول (٣). والشكلان (١٠-أ ، ب) يوضحان منحنى (التيار - جهد) للوصلة سابقة الذكر . ومن المنحنى يمكن استنتاج بارامترات الخلية الشمسية .



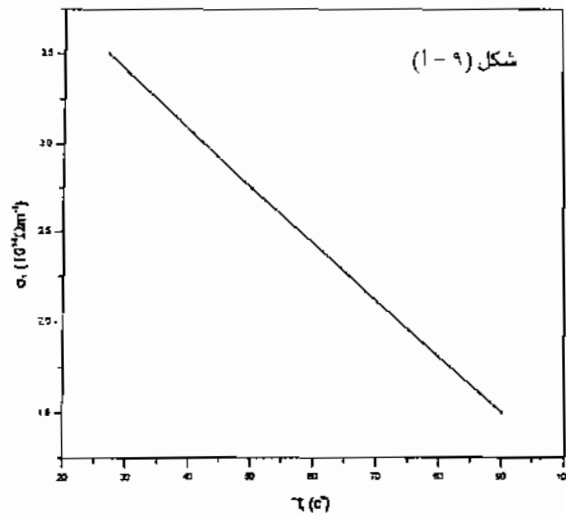
شكل (١٠-أ) : العلاقة بين التيار - جهد للوصلة الثنائية في حالة الإضاءة للسمك ١٢٢ نانومتر.



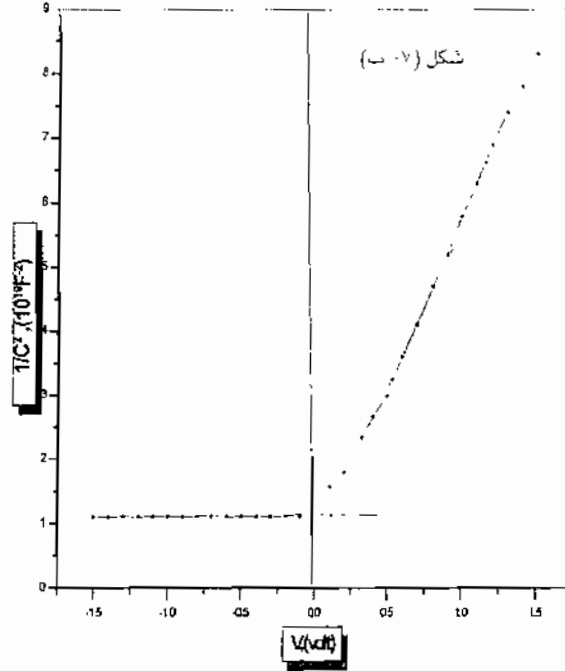
شكل (٨-ب) : العلاقة بين اتساع منطقة الإستنزاف W مع درجة الحرارة t للسمك ٣٥٠ نانومتر.

٦. الموصلية الكهربائية للوصلة الثنائية Electrical Conductivity of the Junction

تم رسم العلاقة بين الموصلية الكهربائية σ بوحدات $(\Omega \text{ m}^{-1})$ ، مع درجات الحرارة المختلفة من درجة حرارة الغرفة وحتى ٩٠ درجة سيليزية لعينتين ذات سمك ١٢٢ نانومتر وأخرى ذات سمك ٣٥٠ نانومتر واتضح من الشكلين (٩-أ ، ب) أن هناك علاقة خطية تناقصية ما بين الموصلية ودرجات الحرارة حيث تقل الموصلية بارتفاع درجة الحرارة ونلاحظ أنها تعتمد على السمك فيتضح أن قيمة الموصلية تزداد بزيادة سمك الشرائح الرقيقة . ولكنها كما يتضح فإنها تسلك سلوكاً مشابهاً لأشباه المعادن Semi metals حيث أن التناسب تناسباً عكسياً ما بين الموصلية الكهربائية ودرجات الحرارة .



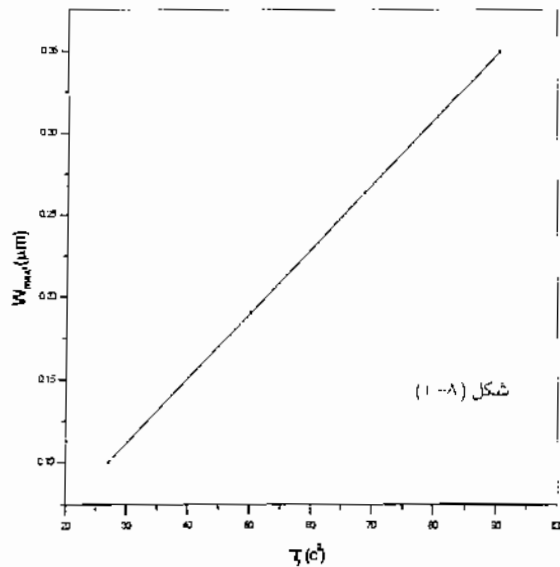
شكل (٩-أ) : العلاقة بين الموصلية σ مع درجة الحرارة t للسمك ١٢٢ نانومتر.



شكل (٧-ب) : منحنيات السعة - جهد المميزة للوصلات الثنائية للسمك ٣٥٠ نانومتر.

٥. عرض منطقة الاستنزاف Width of Depletion Region :

لتعيين عرض منطقة الاستنزاف W_{max} وتغيرها مع درجة الحرارة ، فإنه يمكن تعيينها من خلال الخواص المميزة (السعة - جهد)، (C-V) للوصلة غير المتجانسة n-Si /p-CuGaS₂ حيث يمكن تحديد عرض منطقة الاستنزاف عند درجات حرارة مختلفة تتراوح من 100 - 20 درجة سيليزية والأشكال (٨ - أ ، ب) توضح العلاقة الخطية بين عرض منطقة الاستنزاف W_{max} بوحدات (الميكرومتر) مع درجات الحرارة بالدرجات السيليزية .



شكل (٨-أ) : العلاقة بين اتساع منطقة الاستنزاف W مع درجة الحرارة ١ للسمك ١٢٢ نانومتر.

٤. منحنيات (السعة - جهد) المميزة "C - V" Characteristics Curves :

علاقة (السعة - جهد) للوصلات الثنائية غير المتجانسة H_j يستخدم "تقريب منطقة الاستنزاف Depletion region على فرض أن سعة الوصلة يمكن اعتبارها كمتسلسلة لكل جانب من جوانب الوصلة الثنائية غير المتجانسة، ويعبر عن السعة الكلية لكل وحدة مساحة بالعلاقة :

$$C^2 = \frac{qN_1N_2\epsilon_1\epsilon_2(V_b-V)^{-1}}{2(\epsilon_1N_1+\epsilon_2N_2)}$$

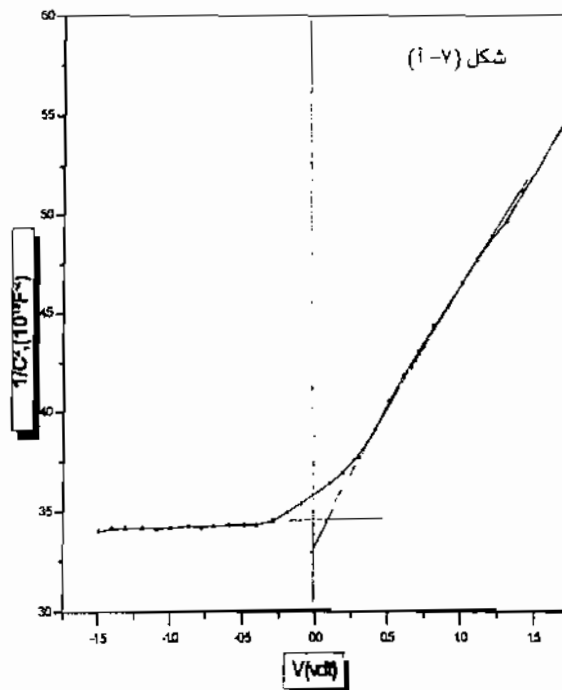
حيث : q شحنة الإلكترون ، و N_1 ، N_2 تركيز حاملات الشحنة الحرة في المادة (١) والمادة (٢) على الترتيب . و ϵ_1 ، ϵ_2 النفاذية الكهربائية للمادة (١) والمادة (٢) على الترتيب. V الجهد المستخدم، V_b جهد البناء الداخلي Built in voltage .

ويرسم العلاقة بين $1/C^2$ مع V يعطي الجزء المقطوع من المحور V قيمة جهد البناء الداخلي V_b والمدونة بالجدول (٢) .

$$1/C^2 = \frac{2(V_b - V)}{Q\epsilon_2N_2A^2}$$

$$V_b = V_{b1} + V_{b2}$$

ومركبات جهد البناء الداخلي خلال شبيهي الموصل . يوضحها الشكلان (٧ - أ ، ب) .

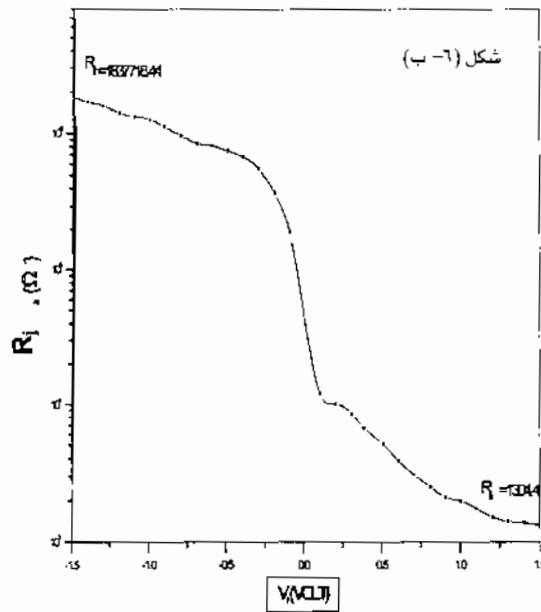
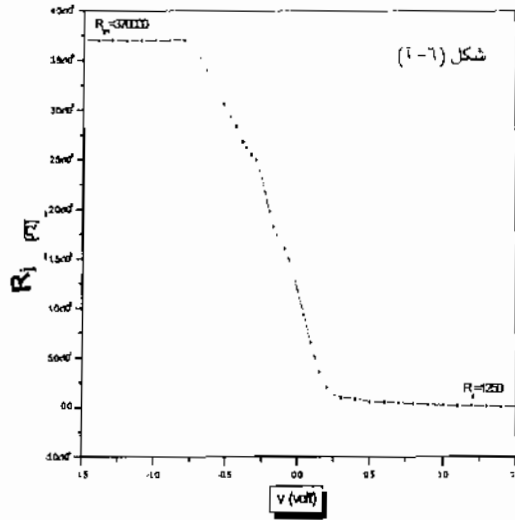


شكل (٧ - أ) : منحنيات السعة - جهد المميزة للوصلات الثنائية للسلك ١٢٢ نانومتر.

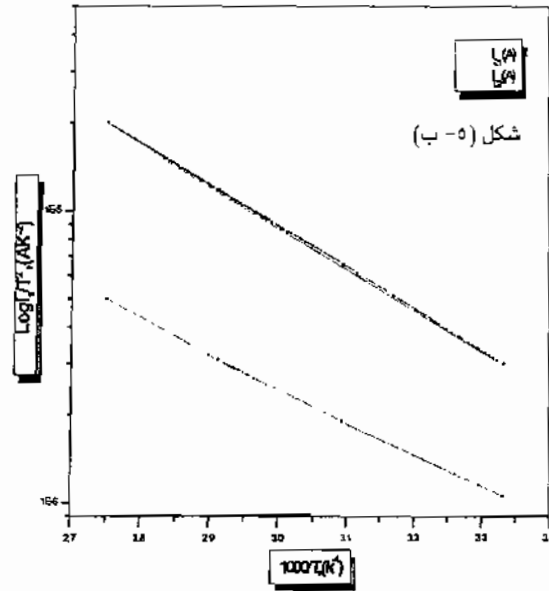
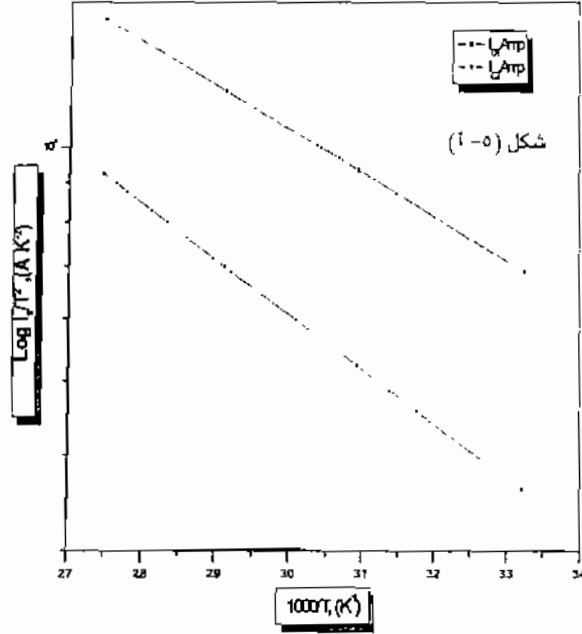
R_{sh} , R_s عن طريق رسم العلاقة بين مقاومة الوصلة R_j Junction resistance والجهد المقابل حيث :

$$R_j = \frac{dv}{dI}$$

والشكلان (٦- أ ، ب) يوضحان العلاقة بين V , R_j حيث يلاحظ أنه عند قيم عالية للجهد فإن مقاومة الوصلة R_j تصل إلى قيمة ثابتة تساوي مقاومة التسلسل R_s بينما عند التحيز الخلفي الكبير تصل مقاومة الوصلة R_j إلى قيمة ثابتة أيضاً وتساوي مقاومة التجزئة R_{sh} ومتوسط قيم R_{sh} , R_s والمحسوبة بالطريقتين السابقتين وللعينات مختلفة السمك مدونة بالجدول (١) .



شكل (٦- أ و ب) : العلاقة البيانية بين مقاومة الوصلة R_j والجهد V في حالة التحيز الأمامي والخلفي للسمك ١٢٢ و ٣٥٠ نانومتر .

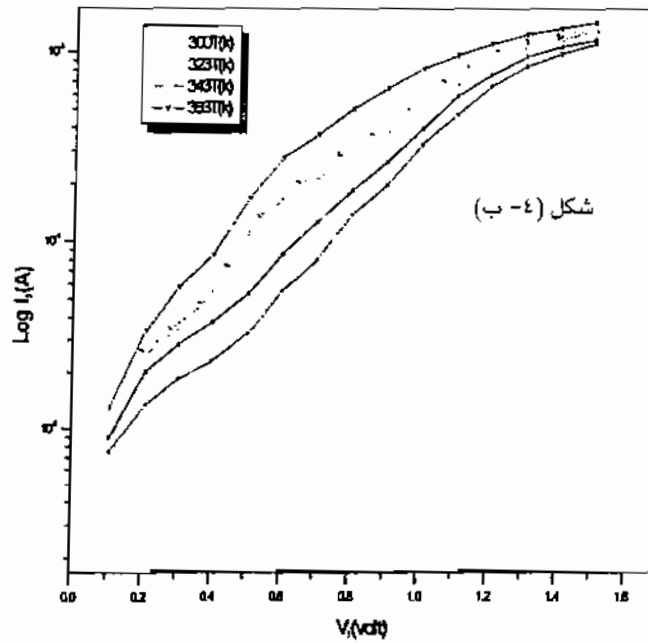
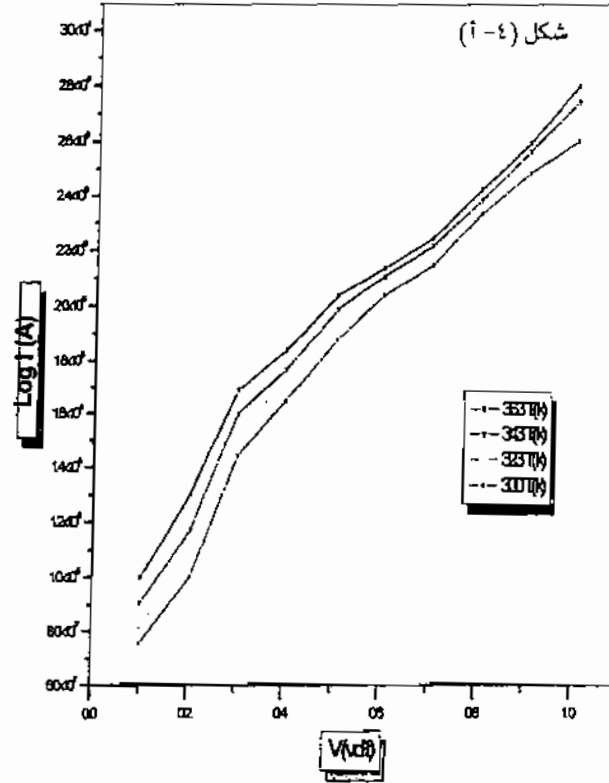


شكل (٥-أ و ب): العلاقة بين $\log I_s/T^2$ و $1000/T$ للوصلات الثنائية عند جهد مقداره ١ فولت للسمك ١٢٢ و ٣٥٠ نانومتر .

باستخدام معادلة شوتكي المعدلة لإدخال تأثير كل من مقاومة التسلسل Series resistance ومقاومة التجزئة Shunt resistance (R_{sh}) وتكتب على الصورة :

$$I = I_s \{ \exp [q (V - IR_s) / n KT] - 1 \} + \frac{V - IR_s}{R_{sh}}$$

حيث يمكن استنتاج قيم كل من مقاومة التسلسل ومقاومة التجزئة من تيار التحيز الأمامي والخلفي عند قيم عالية للجهد على الترتيب ، ولقد اقترح لطفي^[6] وآخرين طريقة جديدة لتعيين



شكل (٤- أ و ب): العلاقة بين $\log I$ والجهد (V) في حالة التحيز الأمامي عند درجات الحرارة المختلفة للسلك ١٢٢ و ٣٥٠ نانومتر .

ومن الميل للخط المستقيم يمكن استنتاج طاقة التنشيط للوصله ΔE لكل قيمة من جهد التحيز الخلفي V_r المعطاة وقيم طاقات التنشيط للوصلات من كل سمك مدونة بالجدول (١).

٣. آليات التوصيل في الوصلات الثنائية من كبريتيد الجاليوم النحاسي-p-سيلكون-n :

Conduction mechanisms in p/n- Si Heterojunctions :

من نظرية الانبعاث الأيوني الحراري في الوصلات الثنائية فإن التيار يعطى بالمعادلة^[1,9]:

$$I = I_s [\exp (q V / n K T) - 1] \quad \dots\dots\dots (2)$$

حيث: KT طاقة بولتزمان عند درجة الحرارة T ، q شحنة الإلكترون I_s تيار التشبع وعند جهد تحيز أمامي ضعيف (0-0.35) فولت فإن تيار التشبع I_s يعطى بالصورة^[1,9] :

$$I_s = I_0 \exp(-q\Phi_b/KT) \quad \dots\dots\dots (3)$$

حيث: I_0 المعامل السابق للدالة الأسية ويساوي $I_0 = AA^*T^2$ ، A مساحة سطح الوصلة ، A^* ثابت ريتشاردسون Richardson Constant ، فإذا ما كان التيار السائد بآلية انبعاث شوتكي لحاملات الشحنة عبر حاجز الجهد للوصلة، فالمعادلة السابقة تكتب على الصورة^[1,9]:

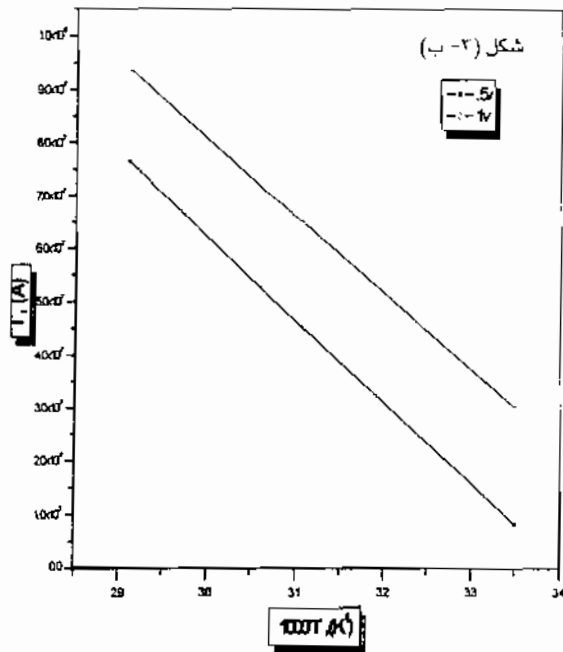
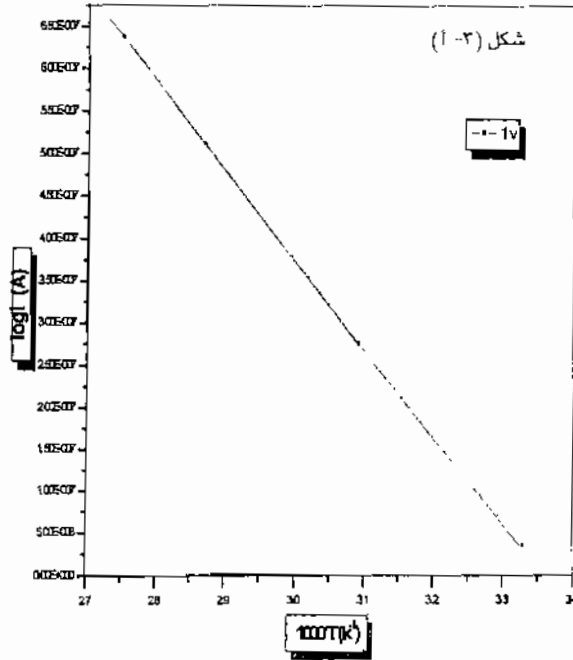
$$I_s = AA^*T^2 \exp (- q\Phi_b/KT) \quad \dots\dots\dots (4)$$

من المعادلة (٤) وبأخذ لوغاريتم الطرفين مع إهمال الواحد بالنسبة للدالة الأسية فإن العلاقة بين $\ln I$ ، V ، تعطي خطأ مستقيماً وميله يعين عامل الجودة للوصلة (n) diode quality factor والشكلين (٤- أ و ب) يوضحان علاقة $\log I$ مع الجهد V في حالة التحيز الأمامي ، وقيم n المستنتجة لكل عينة مدونة بالجدول (١) ، ومن الجدول يتضح أن قيم $n > 1$ مما يدل على أن آلية التوصيل في هذا المدى من الجهد هي آلية الانبعاث الأيوني الحراري ويمكن تأكيد ذلك من المعادلة (٤) حيث رسمت العلاقة بين $\ln I_s/T^2$ و $1000/T$ حيث نحصل على خط مستقيم ميله $q\Phi_b/K$ ومنه يمكن تعيين ارتفاع حاجز جهد شوتكي Φ_b للوصلات المقاسة والشكلين (٥- أ ، ب) يوضحان العلاقة السابقة لنفس الوصلات ويتضح أنها جميعاً خطوطاً مستقيمة بما يحقق معادلة شوتكي (٤). ومما سبق يتضح أن الوصلات الثنائية لها $n > 1$ وهذا يعني مساهمة إعادة الاتحاد للإلكترونات السالبة والثقوب الموجبة داخل منطقة الاستنزاف وأيضاً زيادة تأثير تيار الانتشار مع زيادة جهد التحيز بالإضافة إلى أن ميكانيكية التيار السائد هي آلية الانبعاث الأيوني الحراري.

٢. طاقة التنشيط للتحييز الخلفي Reverse current activation energy :

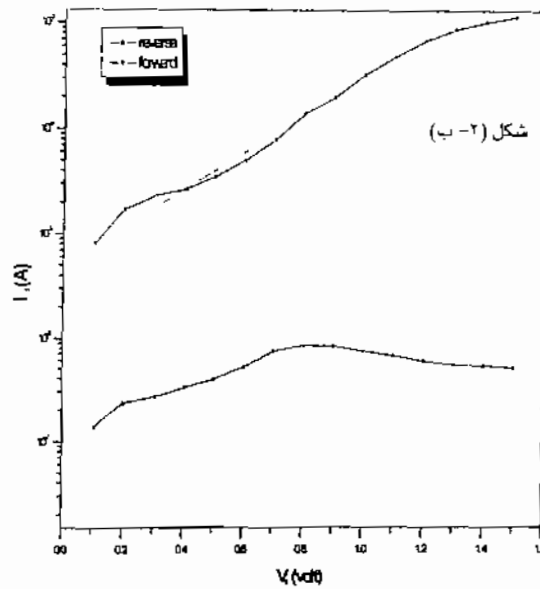
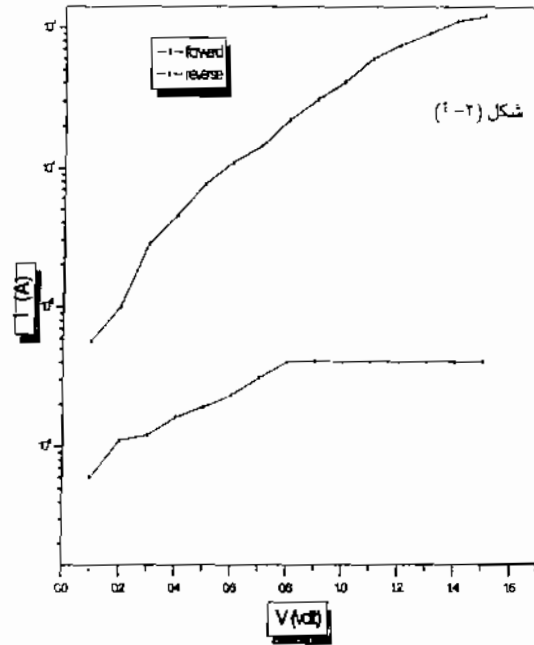
من قيم تيار التحييز الخلفي عند درجات الحرارة المختلفة وعند جهد مقداره ١ فولت
 أمكن تعيين طاقة التنشيط للتيار الخلفي حيث الشكل (٣ - أ ، ب) يمثلان علاقة $1000/T$ مع $\log I_r$ و يتضح منها علاقة خط مستقيم تتبع العلاقة [1, 9]:

$$I_r = \exp (- \Delta E / K T) \dots\dots\dots (1)$$



شكل (٣- أ و ب): العلاقة بين تيار التحييز الخلفي I_r و $1000/T$ للوصلات الثنائية عند جهد مقداره ١ فولت و ٠,٥ فولت للسمك ١٢٢ و ٣٥٠ نانومتر .

ب- التحيز الأمامي له نفس السلوك تقريباً ، عند درجات الحرارة المختلفة حيث أنه بزيادة الجهد، فإن التيار يتزايد أسياً في البداية ، أما عند الجهود المرتفعة فإنه يتزايد خطياً ، الشكلان (٢- أ و ب).



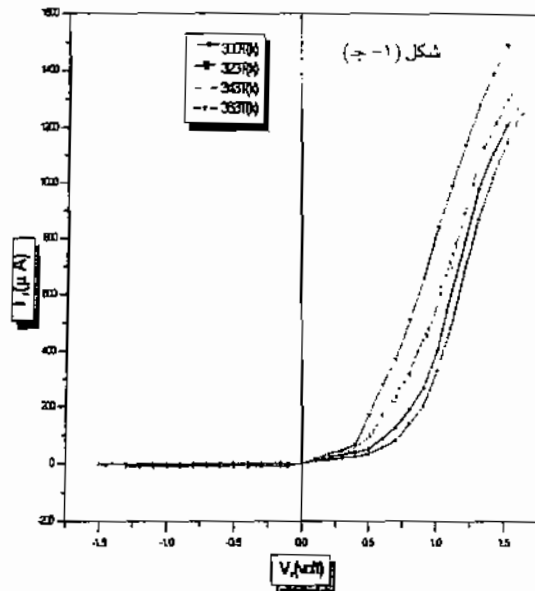
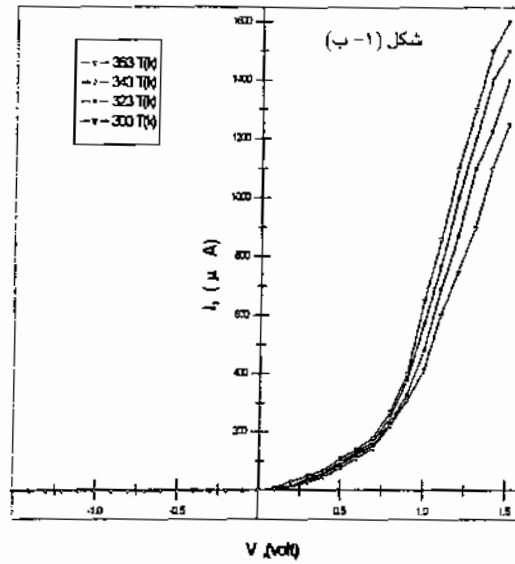
شكل (٢- أ و ب): العلاقة بين التيار - جهد للتحيز الأمامي و الخلفي عند درجة حرارة الغرفة للسمك ١٢٢ و ٣٥٠ نانومتر .

ج- التماثل في المنحنيات مع تدرج درجة الحرارة يعني بأن آليات التوصيل في مدى الجهود المختلفة هي آليات متشابهة لكل العينات . هذا وقد أمكن تحليل تلك المنحنيات واستنتاج البارامترات الهامة للوصلة الثنائية فيما يلي :-

الوصلات الثنائية n-Si / p-CuGaS₂ في حالة الإزلام :

١. منحنيات (التيار-جهد) المميزة (I-V) Characteristics Curves :

لمنحنيات (التيار - جهد) والمميزة للوصلات بوصفها n-Si / p-CuGaS₂ والتي سمك طبقة CuGaS₂ لها ١٢٢-٣٥٠ نانومتر على الترتيب ويوضحها الشكلان (١-ب و ج) حيث يمثل كل شكل منها منحنيات (التيار- جهد) للعينة تحت الدراسة عند درجات حرارة مختلفة في المدى من درجة حرارة الغرفة وحتى ٣٦٣ كلفن ، ومن هذه المنحنيات يمكن استنتاج ما يلي:-
أ- سلوك المنحنيات متشابهة رغم اختلاف سمك طبقة CuGaS₂.



شكل (١-ب و ج): منحنيات التيار (I) جهد (V) المميزة عند درجات الحرارة المختلفة للسمك ١٢٢ و ٣٥٠ نانومتر .

كما تم دراسة منحنيات (التيار - جهد) وكذلك (السعة-جهد) للوصلات الثنائية غير المتجانسة للنظام (ذهب - كبريتيد الجاليوم النحاسي p - سيليكون n - ألومنيوم) حيث تم استنتاج بارامترات الوصلة ، ودونت النتائج في الجدول (١) و(٢) و(٣) وأثبتت النتائج أن آلية التوصيل تتم بالانبعاث الأيوني الحراري عند الجهود المنخفضة نسبياً، وقد تمت دراسة منحنيات (التيار - جهد) في حالة الإظلام والإضاءة لهذا المركب كخلية شمسية، حيث أوضحت العينات كفاءة η تساوي 1.4% وهي تعتبر كفاءة عالية . وكان عامل الامتلاء FF يساوي ٠,٤٧، وجهد الدائرة المفتوحة V_{oc} يساوي ٠,٤ فولت ، وتيار دائرة القصر I_{sc} يساوي ٩٥ ميكروأمبير وذلك للعينة ذات السمك ٣٥٠ نانومتر، أما العينة ذات السمك ١٢٢ نانومتر، فإن الكفاءة η لها تساوي ١,١٥، وعامل الامتلاء FF يساوي ٠,٤٨، وجهد الدائرة المفتوحة V_{oc} يساوي ٠,٣٥ فولت ، وتيار دائرة القصر I_{sc} يساوي ٧٧ ميكروأمبير، ومنها يتضح أن زيادة السمك تسبب زيادة الكفاءة وتحسن من أدائها ، ومن دراسة العلاقة بين اتساع منطقة الاستنزاف مع التغير في درجة الحرارة للسمك ٣٥٠ و ١٢٢ نانومتر، وجدت علاقة طردية بين اتساع منطقة الاستنزاف ودرجة الحرارة والسمك، وكذلك من دراسة العلاقة بين الموصلية ودرجة الحرارة لوحظ وجود علاقة عكسية بين الموصلية ودرجة الحرارة وعلاقة طردية مع السمك ، وقد تم التركيز على تحضير عدد من الوصلات الثنائية المتغايرة من النظام n-Si / p-CuGaS₂ وقياس منحنياتها المميزة (I-V) و(C-V).

جدول (١): بارامترات الوصلة في حالة الإظلام.

d (nm)	$R_{sh}(\Omega)$	$R_s(\Omega)$	n	$\Delta E(eV)$	$I_s(Amp)$	RR
122	3.7E5	1250	1.55	1.187	1E-6	1E2
350	1.8E6	1304	2.12	1.180	2E-7	0.5E3

جدول (2): العلاقة بين السمك و جهد التماس " جهد البناء الداخلي " .

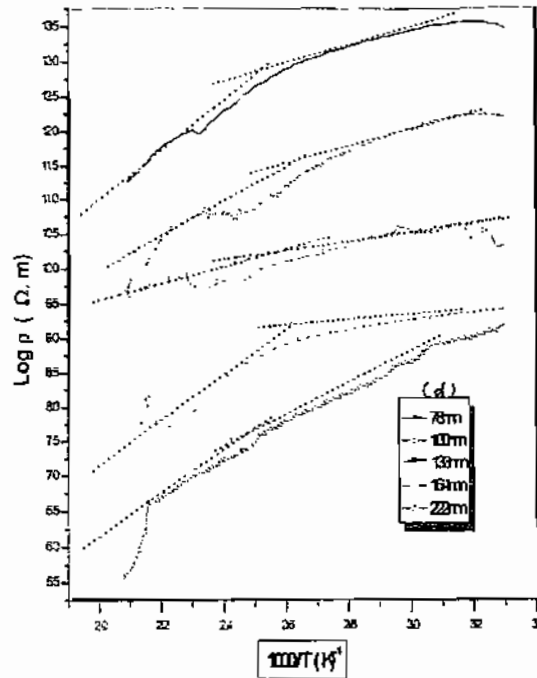
d (nm)	V_b (volt)
122	0.10
350	0.15

جدول (3): بارامترات الخلية الشمسية في حالة الإضاءة .

d(nm)	$I_{sc}(\mu A)$	$V_{oc}(volt)$	FF	η
122	77	0.35	0.482	1.15%
350	95	0.40	0.470	1.48%

التجارب المعملية

تم قياس المقاومة النوعية الكهربائية للشرائح الرقيقة من هذا المركب " والمرسبة على حوامل زجاجية بتقنية تحضير الشرائح الرقيقة من كبريتيد الجاليوم النحاسي CuGaS_2 ، بالتبخير الحراري المعتاد في جو مفرغ (10^{-4} pascal) ، في حالة الإظلام وأيضاً في درجة حرارة العينات تتراوح من درجة حرارة الغرفة وحتى 493 كلفن ، وقد وجد اعتماد المقاومة النوعية الكهربائية لهذه الشرائح الرقيقة على سمك العينات وعلى درجة حرارة المعالجة الحرارية لهذه العينات، حيث تتناقص المقاومة النوعية الكهربائية مع زيادة سمك الشرائح الرقيقة من هذا المركب الثلاثي ، وذلك بسبب تزايد الحجم الحبيبي للتبلورات مع زيادة السمك ، أما بالنسبة لعلاقة المقاومة النوعية الكهربائية بدرجات الحرارة فقد أوضحت العينات سلوكاً في الدورة الأولى يوضح تحول المادة من الحالة شبه الأمورفييه إلى الحالة البلورية ، وسلوكاً مغايراً في الدورة الثانية للتسخين يوضح سلوك الموصلات العادية. ومن العلاقة بين المقاومة النوعية ودرجات الحرارة (شكل ١-أ) أوضحت النتائج سلوكاً لشبه موصل بطاقتي تنشيط الأولى $\Delta E_1 = 0.674$ eV وتمثل سلوكاً شبه موصل غير ذاتي extrinsic ، أما طاقة التنشيط الثانية فإنها تمثل سلوكاً شبه موصل ذاتي interinsic وتساوي $\Delta E_2 = 1.78$ eV ومن هذه القيم تم استنتاج قيمة فجوة الطاقة $E_g = 2.454$ eV وهذه القيمة لمتوسط القيمتين تتفق مع القيم المقاسة في الأبحاث السابقة [4,5,7,8,12] وتتفق مع نتائج القياسات الضوئية.



شكل (١- أ): العلاقة بين المقاومة النوعية ودرجات الحرارة .

المقدمة

تعد الشرائح الرقيقة من أشباه الموصلات هدفاً تسعى إليه تقنية الصناعات الإلكترونية من الثنائيات " الداودات " و الترانزستورات بأنواعها المختلفة ، كذلك في الدوائر التكاملية. كما تبرز الأهمية الكبرى لها في صناعة الخلايا الشمسية على هيئة وصلات ثنائية سواء ، أكانت وصلات متجانسة أم متغايرة [10, 15, 16, 17].

تعتبر المركبات من النظام الثلاثي ($A^I B^{III} C^{VI}$) من أشباه الموصلات الواعدة في مجال صناعة الوصلات الثنائية (الدايودات) والخلايا الشمسية، كما تستخدم كمولدات للطاقة الكهروحرارية، كذلك كمحولات للطاقة، وكأقطاب للتوصيلات الكهربائية وفي التطبيقات الضوئية الحرارية والضوئية الكهربائية والتطبيقات الإلكترونية [11, 18].

احتلت أشباه الموصلات البلورية معظم الأبحاث والدراسات السابقة ، وأوليت العناية الفائقة والاهتمام بها في صورتها الحجمية ، وكذلك في صورتها كشرائح رقيقة بتقنية الترسيب الكيميائي ، أما الأبحاث والدراسات بتقنية التبخير الحراري فإنها نادرة في هذا المجال ، حيث تمتاز هذه الطريقة بإمكانية الحصول على أشباه موصلات لها خصائص معينة مناسبة ومرغوبة في التطبيقات العملية ذات الجودة والكفاءة العالية، وبأقل التكاليف ، حيث يتم فيها استخدام كميات ضئيلة جداً من المادة .

الهدف من الدراسة

تم اختيار شبه الموصل الثلاثي كبريتيد الجاليوم النحاسي $CuGaS_2$ للدراسة في صورته كشرائح رقيقة، لندرة الدراسات السابقة في هذا المجال ، حيث تمت معظم الدراسات له في صورته الحجمية.

هدف البحث و تلخصه فيما يلي:

- (١) تحضير الشرائح الرقيقة من المركب $CuGaS_2$ و دراسة أهم خصائصها الفيزيائية من حيث الخصائص الكهربائية الانتقالية.
- (٢) تحضير و دراسة الوصلات الثنائية المتغايرة (غير المتجانسة) من المركب $CuGaS_2$ على رقائق من السيليكون النقي لاستنتاج بارامترات الوصلة الثنائية و كذلك البارامترات الفولت ضوئية.

الخصائص الكهربائية و الفولت ضوئية للشرائح الرقيقة من شبه الموصل الثلاثي كبريتيد الجاليوم النحاسي

د . فاطمة سالم باهبري

كلية التربية بجدة ، الأقسام العلمية ، قسم الفيزياء

المستخلص. تم قياس المقاومة النوعية الكهربائية لشرائح رقيقة من مركب $CuGaS_2$ المحضرة بطريقة التبخير الحراري المعتاد في جو مفرغ 10^{-4} بسكال في حالة الإظلام وعند درجة حرارة للعينات تتراوح من درجة حرارة الغرفة حتى 493 كلفن، وقد وجد اعتماد المقاومة النوعية الكهربائية لهذه الشرائح الرقيقة على سمك العينات وعلى درجة حرارة المعالجة الحرارية، حيث تتناقص المقاومة النوعية الكهربائية مع زيادة السمك للشرائح الرقيقة من هذا المركب ، وذلك بسبب تزايد الحجم الحبيبي للتبلورات مع زيادة السمك، أما بالنسبة لعلاقة المقاومة النوعية الكهربائية بدرجات الحرارة فقد أظهرت العينات سلوكاً في الدورة الأولى يوضح تحول المادة من الحالة الأمورفية إلى الحالة البلورية، وسلوكاً مغايراً في الدورة الثانية للتسخين يشبه سلوك أشباه الموصلات العادية . ومن العلاقة بين المقاومة النوعية الكهربائية ودرجات الحرارة. أوضحت النتائج سلوكاً شبيه موصل بطاقتي تنشيط الأولى $\Delta E_1=0.674eV$ وتمثل سلوكاً شبه موصل غير ذاتي extrinsic، أما طاقة التنشيط الثانية فإنها تمثل سلوكاً شبه موصل ذاتي intrinsic وتساوي $\Delta E_2 = 1.78eV$ ومن هذه القيم تم استنتاج قيمة فجوة الطاقة $E_g=2.454eV$ ، وهذه القيمة تتفق مع القيم المقاسة في الأبحاث السابقة.

كما تم دراسة منحنيات (التيار-جهد) و كذلك (السعة-جهد) للوصلات الثنائية غير المتجانسة للنظام (ذهب-كبريتيد الجاليوم النحاسي-p - سيليكون -u ألومنيوم) حيث تم استنتاج بارامترات " ثوابت " الوصلة .

